



(주)지엘테크 회사소개서

이 름 : 김호환 대표
연락처 : 010-5660-5256
이메일 : hohwan@gltech.kr
홈페이지: www.gltech.kr

2D.3D측정 .검사/3D 프린터 설비의 글로벌 리더 지엘테크

회 사 명	(주)지엘테크 (GL-Tech Co., Ltd.)
대 표 이 사	김 호 환
설 립 일	2014년 5월 12일
사 업 분 야	• 측정.검사 : 2D. 3D 측정기 • 프린터: TPP 3D 프린터 • 부품사업 : 정밀 직교로봇, 간섭렌즈, 방진 테이블
적 용 분 야	• 측정.검사: Semiconductor, OLED, LCD, PCB Substrate, LED, MEMS, 비구면 렌즈 등의 측정.검사 적용 • 3D 프린터: Semiconductor, MEMS, Sensor, Bio 산업에 나노 마이크로의 미세하고 복잡한 구조에 적용
회 사 주 소	(34325) 대전광역시 대덕구 신일서로85 번길 65, 2동 B호 https://www.gltech.kr



특허 현황

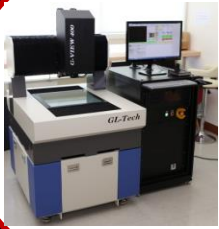
항목	내 용	등록번호/출원번호	국가
상표	GLtech 42류 16007	40-1393123	대한민국
상표	SURFIEW 09류 16007	40-1408540	대한민국
특허	리닉 간섭계의 기준미러 변환장치	10-1458997	대한민국
특허	Reference Mirror Converter of Linnik Interferometry	US 9,684,158 B2	미국
특허	위치 보정기능이 구비된 치수측정기 및 그 방법	10-1660798	대한민국
특허	광학간섭계의 광축 정렬방법	10-1817667	대한민국
특허	판스프링 구조 및 이를 이용한 스캐닝 시스템	10-2024017	대한민국
특허	마이켈슨 간섭계와 이것을 이용한 간섭무늬 획득방법	10-1924888	대한민국
특허	간섭렌즈의 초점과 광축의 곡률 중심이 동일 평면상에 위치하도록 광축을 조절하는 광학간섭계의 광축정렬장치	10-1993621	대한민국
특허	광학장치 흡착판용 다공플레이트 및 이를 포함하는 광학장치용 흡착판	10-2105479	대한민국
특허	외관불량 검사방법 및 외관불량 검사 시스템	10-2150673	대한민국
특허	동일한 광경로를 이용한 3차원 형상측정장치와 방법	10-2092638	대한민국
특허	초점위치와 광축의 조정이 가능한 반사계	10-2210348	대한민국
특허	표면형상 측정장치 및 그 제어방법	10-2509303	대한민국
특허	광학식 측정장치와 광학식 측정장치용 조명유닛	10-2627777	대한민국
특허	광학식 측정장치와 광학식 측정장치용 렌즈터렛유닛	10-2675829	대한민국
특허	이광자 중합 반응을 이용한 3D 프린팅 시스템	10-2023-0009397	대한민국
특허	다기능 공작기계	10-2750031	대한민국
특허	이광자 중합 반응을 이용한 멀티 3D 프린팅 시스템	10-2023-0140389	대한민국
특허	향상된 자동 초점 기능을 갖는 이광자 중합 반응을 이용한 3D 프린팅 시스템	10-2024-0192355	대한민국

인증 현황

항목	내 용	인증번호	비고
미래성과공유기업	성과공유기업 확인서	제2020-012815호	
창업기업확인서	창업기업확인서	202106-26129-0004864	
벤처기업인증	벤처기업확인서	20210729020089	
중소기업인증	중소기업확인서	0010-2021-122208	
기업부설연구소	기업부설연구소인정서	2015112914	
ISO-90001	ISO 9001:2015 / KS Q ISO 9001:2015	QMC-1088	
이노비즈	기술혁신형 중소기업(Inno-Biz) 확인서	200501-00881	
CE인증	3D MEASUREMENT SYSTEM(SURFIEW)	K12546/M20	
프로그램 등록	Surface MAP	C-2021-054876	
기타	위험성평가 인정서	제18-41-D-51호	
포상	중소벤처기업부 표창	제4831호	
기타	생기원-파트너기업 지정서	2022-0096	

지엘테크 Core Technology





2D 측정기



3D 측정기



2D/3D Hybrid



PCB투입수취자동
3D 측정기



Wafer 3D측정기



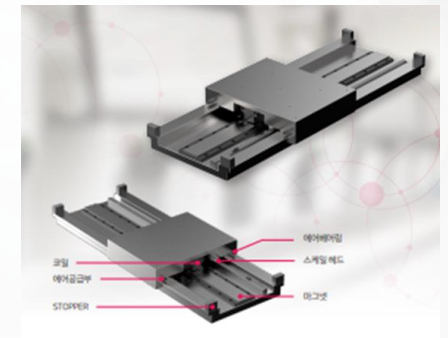
TPP 3D 프린터



간섭렌즈



방진 테이블



에어 베어링 직교로봇

Overview

- **Measurement principle** : 3D surface measurement using white light interference (WLI)
- **Measurement items** : Roughness, Height, Width, Depth, Diameter, Volume, Warpage, Angle, Wear shape, Waviness, Eccentricity, Scratch, Particle, Distance, etc.
- **Application** : semiconductors, displays, PCBs, precision machining, lenses, sensors, films, optics, MEMS, etc.

Advantages

- **Ultra-high resolution**: Less than 0.1 nm height resolution
- **Versatility**: Measures diverse topographic shapes with interference lenses
- **Large FOV**: Achieved with low-magnification interference lens
- **Various types of data analysis** are possible using advanced analysis SW **(Mountains Map/Option)**
- **High reliability**: Excellent Gage R&R performance
- **Flexibility**: Large aspect-ratio topography measurement possible
- **Supports both 2D and 3D measurement**
- **CD measurement** with sub- μm resolution
- **Cost-effective**: Self-developed interference lenses ensure excellent value

Benchtop System

Academy Series

- Single Lens Type
- Scan : 100 μm



Compact Series

- 5 lens Available(Manual)
- Scan : 150 μm
- X/Y/Z : Manual



Elite Series

- 5 lens Available(Auto)
- 2 Zoom change(Auto)
- Scan : 150 μm
- X/Y/Z : Auto
- Stitching/Auto Focus



Pro Series

- 5 lens Available(Auto)
- 3 Zoom change (Auto)
- Scan : 300 μm
- X/Y/Z : Auto
- Stitching/Auto Focus

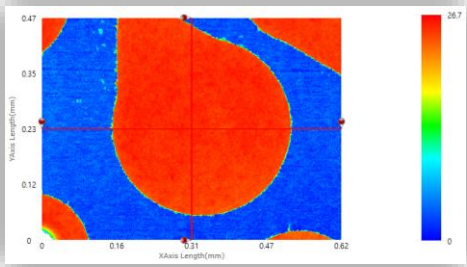


Inline System

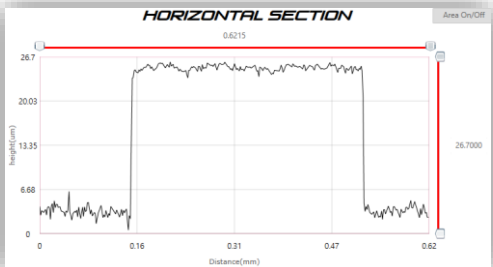
Master Series

- 6 lens Available(Auto)
- 5 Zoom change (Auto)
- X/Y/Z : Auto
- Recipe(Auto measure)
- Scan : 300 μm
- Auto Focus
- Full Auto, Data gathering
- Gage R&R





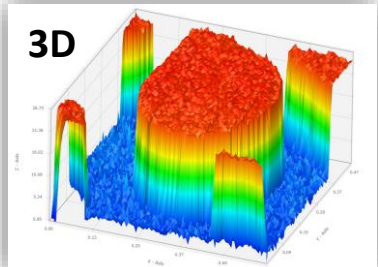
Surface



Profile(Horizontal/Vertical/Arbitrary)



Multi-Profile(Horizontal/Vertical)

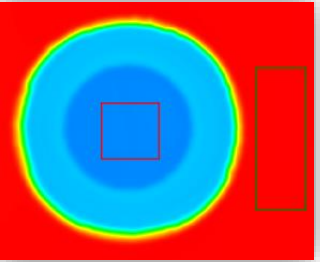


- Roughness(ISO25178, ISO4287)

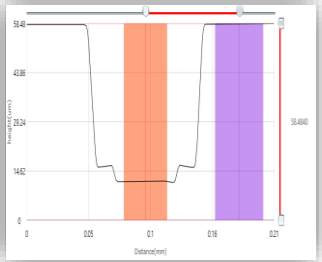
ITEM	VALUE
Sa [um]	12.28994
Sq [um]	16.10654
St [um]	50.05426
Sp [um]	7.98698
Sv [um]	-42.06728
Sz [um]	48.35274

ITEM	VALUE
Ra [um]	21.27519
Rq [um]	21.77712
Rt [um]	49.75486
Rp [um]	21.79836
Rv [um]	-27.9565
Rz [um]	47.54346

- Step Height

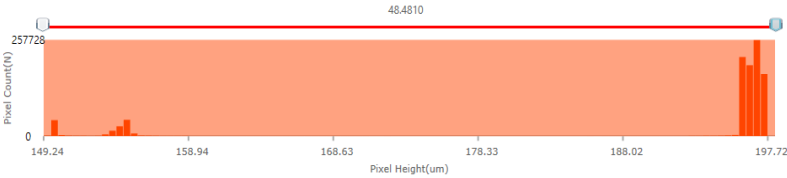


ITEM	VALUE
Height [um]	46.70392

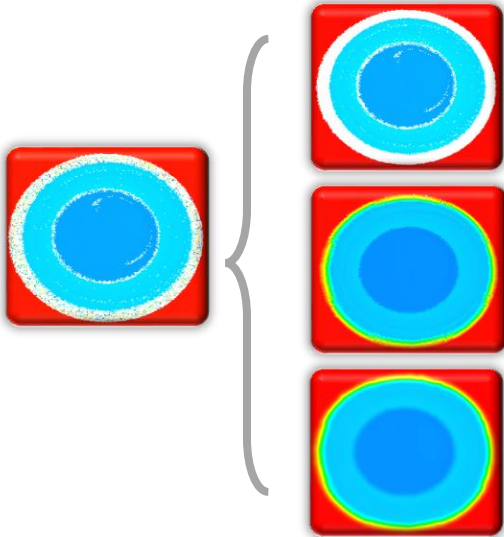


ITEM	VALUE
Height [um]	46.81091

- Histogram analysis
 - Remove selected area
 - Slope correction using selected area



- Surface
 - Slope correction
 - Using selected area
 - Zoom In/Out



Noise Reduction Filtering

- Peak-Noise Reduction
- Median
- Gaussian
- Along NG

Restoration Filtering

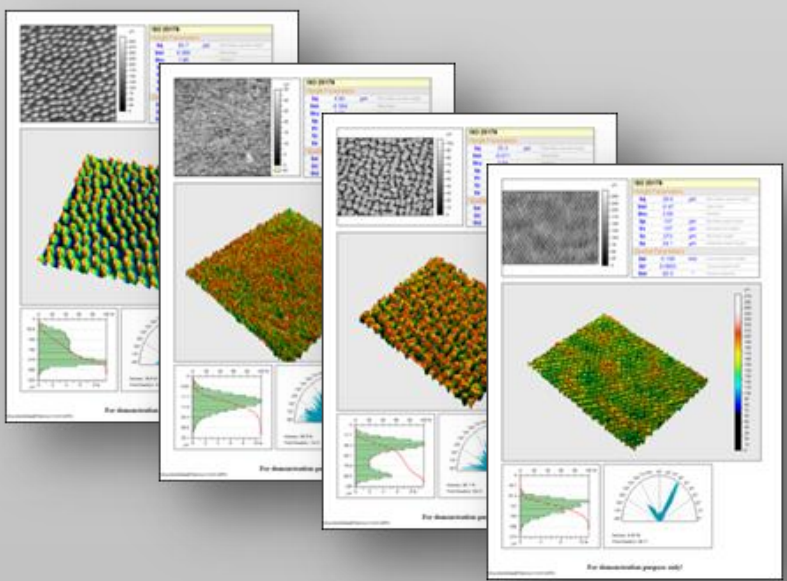
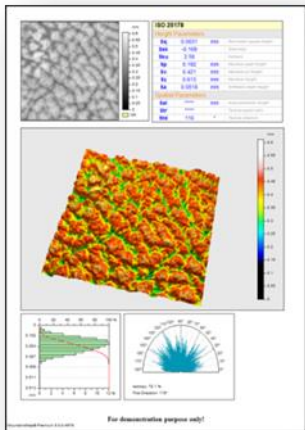
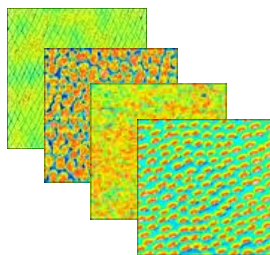
- Radial
- Horizontal
- Central

Smoothing Filtering

- Gaussian
- Low-pass

Use Mountains Map's Documents As Templates (Option)

Document



Pdf File

Sample 1 - Book																		
09-22-2025																		
1	09-22-25	10:35:09																
2																		
3	Name	Value	Unit	Content	Frame Not Studiable name													
4	X축 회전	-0.107096°			OPERATO SurfaceMap > 재워진 비국정된 형													
5	Y축 회전	-0.13367°			OPERATO SurfaceMap > 재워진 비국정된 형													
6	Sq	0.087489	µm		3 SurfaceMap > 재워진 비국정된 형 > 수평 처리됨(SPL)													
7	Sk	-0.7978	<no unit>		3 SurfaceMap > 재워진 비국정된 형 > 수평 처리됨(SPL)													
8	Sku	5.552723	<no unit>		3 SurfaceMap > 재워진 비국정된 형 > 수평 처리됨(SPL)													
9	Sp	2.853727	µm		3 SurfaceMap > 재워진 비국정된 형 > 수평 처리됨(SPL)													
10	Sv	3.532034	µm		3 SurfaceMap > 재워진 비국정된 형 > 수평 처리됨(SPL)													
11	Sz	6.384761	µm		3 SurfaceMap > 재워진 비국정된 형 > 수평 처리됨(SPL)													
12	Sa	0.506638	µm		3 SurfaceMap > 재워진 비국정된 형 > 수평 처리됨(SPL)													
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		

csv / txt File

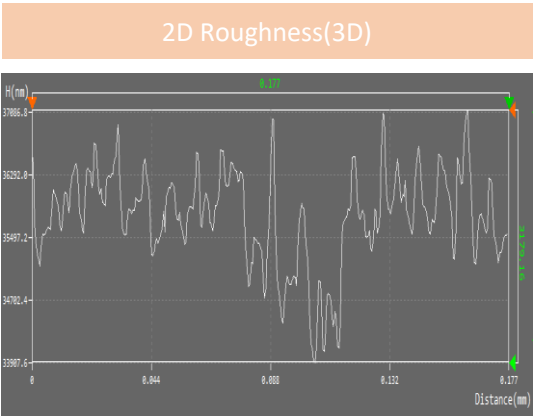
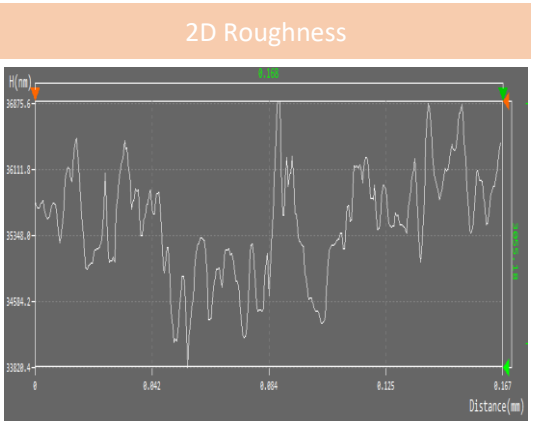
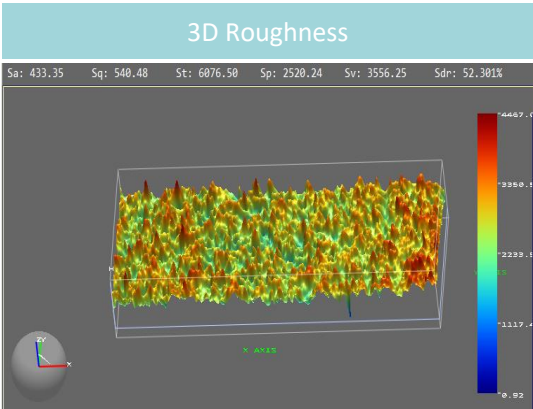
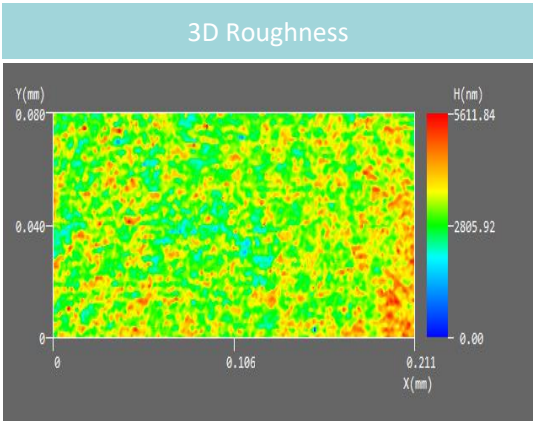
3D Parameter

3D

ISO - 25178

- Sa - Mean Height
- Sq - Root Mean Square Height
- Sp - Maximum Peak Height
- Sv - Maximum Pit Height
- Sz - Maximum Height
- Sdr - Surface Area Ratio
- Etc...

Interferometry



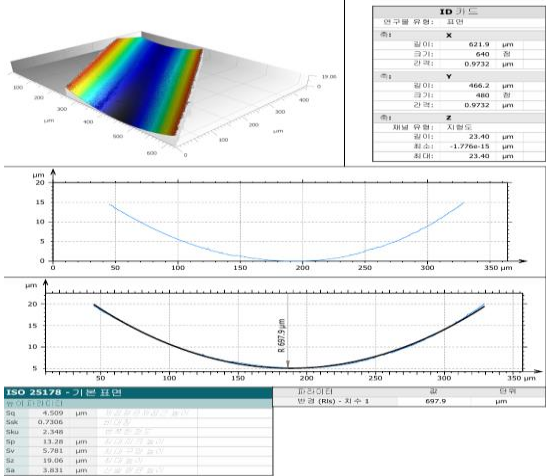
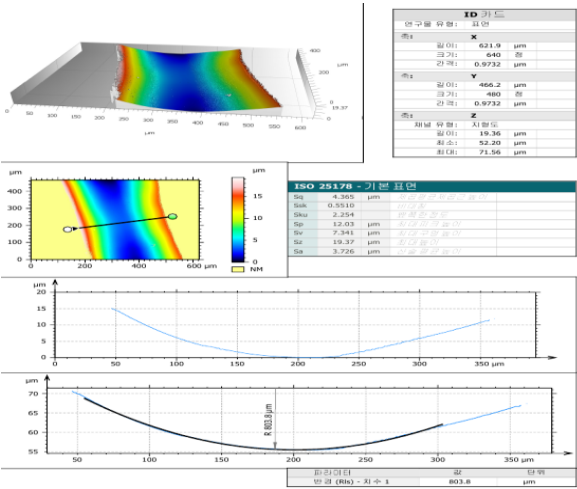
2D Parameter

2D

ISO - 4287

- Ra - Roughness Average
- Rq - Root Mean Square Roughness
- Rp - Maximum Peak Height
- Rv - Maximum Valley Depth
- Rsk - Skewness
- Rku - Kurtosis
- Rt - Maximum Peak-to-Valley Height
- Rc - Mean Height
- Rz - Maximum Height

Interferometry



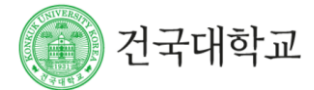
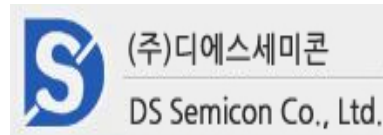
주요 거래처



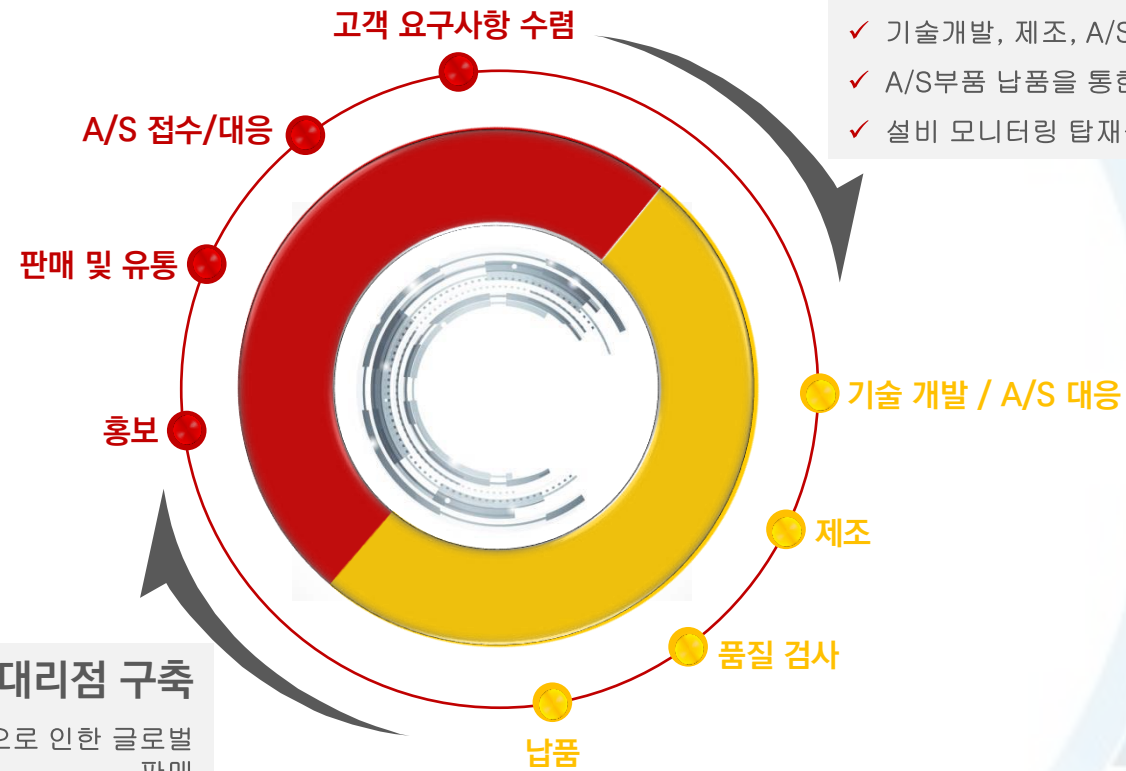
삼성전기



ChemOptics



원 스톱 서비스



✓ GL Tech GLOBAL

- ✓ 기술개발, 제조, A/S 대응
- ✓ A/S부품 납품을 통한 추가 부가가치 창출
- ✓ 설비 모니터링 탑재를 통한 원활한 A/S

✓ 현지 대리점 구축

- ✓ 현지 대리점 및 생산시설 구축으로 인한 글로벌 판매
- ✓ 홍보, 판매, A/S 접수
- ✓ 온라인 마케팅을 통한 홍보

감사합니다.



www.gltech.kr